

半導体集積回路信頼性認定ガイドラインセミナー

～日本発 世界標準化 電子部品認定規格策定 活動紹介～

<品質・信頼性を確保する新しい信頼性認定規格の世界標準化動向>

- 主催：半導体信頼性技術小委員会
- 担当部署：電子デバイス部
- 参加者数：40名

概要

当協会「半導体技術委員会」の下部組織である「半導体信頼性技術小委員会」では、2011年4月に技術レポートとして「EDR-4708／半導体集積回路信頼性認定ガイドライン」を発行し、現在 日本発国際標準化（IEC化）を進めております。啓蒙活動の一環として、2月22日に東京（連合会館201会議室）で、セミナーを開催しました。

本セミナーでは、国内自動車メーカーの期待はじめユーザー製品サイドから日本電機工業会／機能安全検討委

員会の方にもご参加いただき、半導体信頼性に対する期待のご講演をいただきました。また、各委員の方から、テキストを基に世界標準化動向および「短TAT、低コスト、高品質・高信頼性で安心できる製品供給」を可能にする製品認定ガイドラインの詳細紹介をいただきました。

今後も半導体信頼性技術に関わる有益なセミナーを開催し、参考となる最新の話題を提供したいと考えています。



プログラム

司会：伊賀洋一 氏 半導体信頼性技術小委員会／認定WG主査（ルネサスエレクトロニクス株）

○開催の挨拶

瀬戸屋 孝 氏 半導体信頼性技術小委員会 主査（株東芝）

○基調講演

『ドライブ機器の機能安全から見た半導体信頼性に対する期待』

佐藤以久也 氏 日本電機工業会／機能安全検討委員会（富士電機株）

○質疑応答

○本ガイドラインの概要紹介

『世界標準化への取り組み』

伊賀洋一 氏 認定WG主査（ルネサスエレクトロニクス株）

『品質グレードと用途～摩耗故障』

大日方浩二 氏 認定WG委員（ソニー株）

『信頼性試験～解説』

干場一博 氏 認定WG委員（ローム株）

○質疑応答

○閉会の挨拶

田中政樹 氏 半導体信頼性技術小委員会 副主査（ルネサスエレクトロニクス株）